

# Examen final de probabilité

30 Novembre 2023

La durée de l'épreuve est de 1h 30. Une attention toute particulière sera portée à la qualité de la rédaction et aux justifications.

---

**Exercice 1** (Loi sans mémoire). Soit  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  un espace de probabilité. Soit  $B \in \mathcal{F}$  tel que  $\mathbb{P}(B) \neq 0$ , on définit la probabilité conditionnelle sachant  $B$ , notée  $\mathbb{P}(\cdot|B)$ , par : pour tout  $A \in \mathcal{F}$ ,

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

1. Soit  $A \in \mathcal{F}$  tel que  $\mathbb{P}(A) \neq 0$ . Montrer que

$$\mathbb{P}(B|A) = \frac{\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(A)} \mathbb{P}(A|B).$$

2. Soit  $X$  une variable aléatoire de loi géométrique  $\mathcal{G}(p)$ , avec  $p \in ]0, 1[$ . Pour  $k, l \in \mathbb{N}$ , montrer que

$$\mathbb{P}(X > k + l | X > k) = \mathbb{P}(X > l). \quad (*)$$

Une loi ayant la propriété (\*) est dite sans mémoire. On veut montrer que la loi géométrique est la seule. Soit  $X$  une loi discrète à support dans  $\mathbb{N}^*$ . On suppose que la loi de  $X$  satisfait (\*). On définit pour tout  $k \geq 1$ ,  $u_k = \mathbb{P}(X > k)$  et on pose  $p = 1 - u_1$ .

3.a) Établir la relation de récurrence  $u_{k+1} = u_1 u_k$  pour tout  $k \geq 1$ .

3.b) Montrer que  $X \sim \mathcal{G}(p)$ .

---

**Exercice 2** (Durée de vie d'un circuit électrique). On modélise la durée de vie d'une ampoule électrique par une variable aléatoire  $X$  de loi exponentielle  $\mathcal{E}(\lambda)$ , avec  $\lambda > 0$ .

1.a) Calculer la fonction de répartition de  $X$  et la tracer.

1.b) Montrer que  $\mathbb{E}[X] = 1/\lambda$ .

1.c) Quelle est la dimension physique de  $\lambda$ ? Que dire de la durée de vie de l'ampoule quand  $\lambda$  augmente.

On considère deux ampoules branchées en série. Le circuit tombe en panne quand la première des deux ampoules tombe en panne. On note  $X$  et  $Y$  les deux variables aléatoires indépendantes qui modélisent la durée de vie de ces deux ampoules et  $Z$  la variable aléatoire qui modélise la durée de vie du circuit. On suppose que  $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$  et  $Y \sim \mathcal{E}(\mu)$  avec  $\lambda, \mu > 0$ .

2.a) Exprimer  $Z$  en fonction de  $X$  et  $Y$ .

2.b) Calculer  $\mathbb{P}(Z \geq x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .

2.c) En déduire la loi de  $Z$ .

---

**Exercice 3** (Une loi peu usuelle). On pose  $f$  la fonction défini sur  $\mathbb{R}$  par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{a}{x^2\sqrt{x}} & \text{si } x \geq 1 \\ 0 & \text{si } x < 1 \end{cases}$$

1. Déterminer  $a \in \mathbb{R}$  pour que  $f$  soit une densité de probabilité.
2. Soit  $X$  une variable aléatoire de densité  $f$ . Calculer la fonction de répartition de  $X$ . La tracer.
3. La variable aléatoire  $X$  est-elle intégrable ? Si oui, calculer son espérance.

---

**Exercice 4** (Pièce défectueuse). Un industriel souhaite déterminer la proportion,  $p$ , de pièces défectueuses fabriquées dans son usine. Pour cela, il prélève aléatoirement  $n$  pièces. On modélise cette expérience par  $n$  variables aléatoires  $(X_i)$ , indépendantes, de loi  $b(p) : X_i = 1$  si la pièce  $i$  est défectueuse et  $X_i = 0$  si la pièce  $i$  est conforme. On note  $S_n$  la somme des  $X_i$ .

1. Quelle est la loi de  $S_n$  ? Calculer l'espérance et la variance de  $\frac{S_n}{n}$ .
2. Démontrer que pour tout  $\varepsilon > 0$ ,

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{1}{4n\varepsilon^2}.$$

(indication : quel est le maximum de  $x \mapsto x(1-x)$  sur  $[0, 1]$  ?)

3. Déterminer  $n$  tel que  $\frac{S_n}{n}$  approche  $p$  à  $10^{-2}$  près avec une probabilité supérieure à 95%.